無鉛銲料與 Au/Pd/Ni/Cu 基材界面反應之研究

顏怡文¹ 方揚凱² 劉為開¹ 李嘉平² 許景翔³ ¹國立台灣科技大學材料科技研究所²國立台灣科技大學化學工程系³優勝奈米科技有限公司 NSC 93-2218-E-011-02

本研究主要針對 Sn、Sn-3.0Ag-0.5Cu (SAC)、Sn-0.7Cu (SC)、Sn-58Bi (SB)、Sn-9Zn (SZ)無鉛銲 料與 Au/Pd/Ni/Cu 基材在 270℃溫度下,以反應偶形式進行 1、2 及 4 小時之液/固反應,探討其 界面反應行為。實驗結果顯示,Sn/Au/Pd/Ni/Cu、SAC/Au/Pd/Ni/Cu、SC/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶中, 界面上主要以生成(Cu,Ni)₆Sn₅與 Cu₃Sn 兩種介金屬相;隨著反應時間增加,(Cu,Ni)₆Sn₅相有逐漸 往銲料中剝離之現象。SB/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶中,Ni 鍍層未完全消耗,界面上則生成 Ni₃Sn₄相。 SZ/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶中,反應初期界面上可發現 Pd₂Zn₉相與 NiZn 相生成,隨著反應時間延長, 除了 Pd₂Zn₉相外,還會有 NiZn 相與 Ni₅Zn₂₁相共存於界面上。

關鍵字:無鉛銲料、反應偶、界面反應、介金屬相

1、前言

隨著全球對於環保意識的高漲,於 2006 年 7 月 1 日歐 盟已正式實施電子電機廢棄物(WEEE)與有害物質限制法令 (RoSH) 等無鉛相關條例,將會危害環境生態與人體健康的 電子產品予以禁用和限制[1]。傳統 Sn-37Pb 銲料雖具有良好 的銲接性、導電性、潤濕性、機械性等性質,而被廣泛的應 用在電子元件與電路板間的銲接接合[2-3],但由於 Pb 為毒 性金屬,為全面取代含鉛的電子構裝製程銲料,達到無鉛製 程的目標,目前工業界已研發數種無鉛的銲料合金,其中以 純 Sn、Sn-3.0Ag-0.5Cu、Sn-0.7Cu、Sn-58Bi、Sn-9Zn 等為 最具潛力的無鉛銲錫合金[4-9]。

一般在覆晶與 BGA 製程上, Sn-3.0Ag-0.5Cu 適合用於 迴銲製程[6],而 Sn-0.7Cu 則適合於波銲製程[5,8]。兩者皆 好的機械性質,但因 Sn-0.7Cu 銲料不含 Ag 元素,所以成本 上優於 Sn-3.0Ag-0.5Cu 銲料。Sn-58Bi 銲料之共晶溫度為 139℃,適合用於通訊產品及消費性電子產品的構裝中,而 且不論在接點可靠度或成本上等各方面都與傳統 Sn-37Pb 料相近[9]。Sn-9Zn 銲料共晶溫度為 198℃與 Sn-37Pb 銲料的 熔點 183℃相當接近,除了製程上的改變差異較小,其機械 性質也優於 Sn-37Pb 銲料[7]。

除了銲料使用無鉛銲料,印刷電路板與金屬表面處理 (surface finish)也需改用無鉛銲料[10-12]。為了提升銲接的可 靠度,利用銅導線上電鍍 Au/Ni、Pd/Ni、Au/Pd/Ni 為最普遍 的表面處理方式[13]。Au 鍍層具有抗氧化及增加銲料與墊層 間的潤濕性;Pd 鍍層除了可提升潤濕性,亦可作為 Ni 遷移 的阻擋層;Ni 鍍層則作為擴散阻障層,用來防止 Cu 與銲料 快速反應,如此可使許多銲料與 Ni 基材反應而緩慢介金屬 相的產生。

近年來無鉛銲料與 Cu 或 Ni 界面反應的相關研究頗多。 Sn、Sn-3.0Ag-0.5Cu、Sn-0.7Cu、Sn-58Bi 與 Cu 基材的界面 反應中,界面生成物主要以 Cu₆Sn₅ 與 Cu₃Sn 雨相共存[4-6]。 Sn-9Zn/Cu 界面反應則以 Cu₆Sn₅ 相與 Cu₅Zn₈ 相為主要的界 面生成物[7]。然而 Sn/Ni 與 Sn-58Bi/Ni 反應中,界面上皆有 Ni₃Sn₄相生成。Sn-3.0Ag-0.5Cu/Ni 與 Sn-0.7Cu/Ni 反應中, 則以 Sn-Cu-Ni 所形成(Cu,Ni)₆Sn₅ 的三元化合物存在於界面 上[10-12]。Sn-9Zn/Ni 界面反應中,Ni₅Zn₂₁相則為主要的界 面生成物[7]。

目前有文獻中並無無鉛銲料與多層結構基材 -Au/Pd/Ni/Cu 之界面反應的資料。故本研究選用 Sn、 Sn-3.0Ag-0.5Cu、Sn-0.7Cu、Sn-58Bi、Sn-9Zn 五種當前廣泛 使用的無鉛銲料,與 Au/Pd/Ni/Cu 基材於反應溫度 270℃, 分別進行不同反應時間的液/固界面反應,探討其界面反應 行為。

2、實驗方法

2.1 合金製備與反應偶製作

先將 Au (75 nm)/Pd (0.21 μm)/Ni (1.78 μm)/Cu 表面處理 層基材切割成尺寸大小約 1.0 cm × 0.5 cm,為確保基材表面 乾淨,使用超音波震盪機,以酒精與去離子水來去除表面的 油漬與氧化物。再將 Sn、Sn-3.0Ag-0.5Cu、Sn-0.7Cu、 Sn-58Bi、Sn-9Zn 五種銲料,以電子天平秤取重量為基材的 三倍重。在基材兩側塗上 RMA 助銲劑,並與銲料同時置於 真空度低於 10^{-5} bar 之下進行封管,接著放入加熱錫爐內反 應,設定反應溫度為 270℃,進行反應時間為 1、2 及 4 小時 之液/固界面反應。

2.2 金相處理與分析方法

反應完成後,取出反應偶試樣快速淬冷。將其置於鑲埋 機中,利用高溫、高壓將導電性電木粉熔融壓模,使鑲嵌於 內的試樣以利於研磨、拋光等金相處理程序。使反應界面的 表面平整光滑後,將反應偶試樣浸入不同比例的混合酸液, 如 Table 1 所示,進行酸蝕刻 5 分鐘以去除銲料合金,再以 去 離 子 水 與 丙 酮 清 洗 。 試樣 先 以 光 學 顯 微 鏡 (optical microscope, OM)與場發射掃描式電子顯微鏡(field emission scanning electron microscope, FE-SEM)觀察反應偶界面生成 相 的 形 態 , 再 以 能 量 分 散 光 譜 儀 (energy dispersive spectrometer, EDS)與電子微針探測儀(electron probe x-ray micro-analyzer, EPMA)分析界面生成相的組成。

Table 1 各銲料對應蝕刻酸液組成比例

Solder	Sn / Sn-0.7Cu / Sn-9Zn	Sn-3.0Ag-0.5Cu	Sn-58Bi
Etchant	CH ₃ OH : HCl : HNO ₃ 93 : 2 : 5	CH ₃ OH : HCl 9 : 1	HNO ₃ : H ₂ O 1 : 1

3、結果與討論

3.1 Sn/Au/Pd/Ni/Cu 之界面反應

Fig. 1(a)為 Sn/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶,於反應溫度 270°、反應時間 1 小時的背向散射影像(BEI)。反應一開始,鍍層 Au、Pd 皆溶進銲料裡,留下 Ni 鍍層與 Sn 銲料反應,於界 面上可以觀察到兩層不同顏色的相,靠近銲料顏色為淺灰 色,厚度較厚且不平整,經由 EPMA 定量分析,其組成為 Sn-37.16 at.% Cu-16.31 at.% Ni-0.37 at.% Pd,比對 Sn-Cu 與 Sn-Ni 二元相圖[14-15],可得知其為(Cu,Ni) $_6$ Sn₅相。然而靠 近基材顏色為深灰色,厚度較薄且不連續,經由 EPMA 定

量分析,可得知此為 Cu₃Sn 相。Fig. 1(b)為 Sn/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶,於反應溫度270℃,反應時間2小時的BEI影像。 隨著時間增長, (Cu,Ni)6Sn5 相與 Cu3Sn 相兩者厚度皆有增 厚,有趣的是,(Cu,Ni)6Sn5相有逐漸往銲料中剝離的現象。 Fig.1(c)為 Sn/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶,於反應溫度 270℃,反應 時間 4 小時的 BEI 影像。圖中往銲料中剝離的(Cu,Ni)₆Sn₅ 相,經由 EPMA 定量分析,其組成為(Cu_{0.59}Ni_{0.41})₆Sn₅; 而靠 近 Cu₃Sn 相的(Cu,Ni)₆Sn₅相,其組成則為(Cu_{0.84}Ni_{0.16})₆Sn₅。 因此整個反應機制應為:首先鍍層 Ni 會朝液態 Sn 的方向擴 散,準備與 Sn 反應,在 Ni 與 Sn 即將反應的過程中,由於 Cu 在 Sn 中的擴散速率會大於 Ni 在 Sn 中的擴散速率[16], 因此 Cu 快速的取代了 Ni 與 Sn 的反應,在靠近 Cu 端的區 域由於 Cu 濃度較高,因此會生成 Cu₃Sn 相,靠近 Sn 端的 Cu 濃度逐漸低因此會傾向生成 Cu6Sn5相,此時在界面上原 本要與 Sn 反應的 Ni,由於反應被 Cu 所取代,由於 Cu 對 Ni 的最大固溶在 270℃時約為 20%,因而導致界面上的 Ni 會固溶進入 Cu 中,致使(Cu,Ni)₆Sn₅相的生成。



Fig. 1 Sn/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶,在反應溫度 270℃下,於不同 反應時間(a) 1 小時(b) 2 小時(c) 4 小時之 BEI 影像, (d)為酸蝕刻 5 分鐘之界面 SEI 影像。

Fig. 1(d)為 Sn/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶,於反應溫度 270°C, 反應時間 1 小時,酸蝕刻 5 分鐘後的二次電子影像(SEI)。不 同於純 Cu 與純 Sn 界面所產生的 Cu₆Sn₅相為著名的扇貝狀 之晶粒,溶入 Ni 的(Cu,Ni)₆Sn₅相成長形態則為多邊形角柱 體(polyhedron-type)之晶粒,且大晶粒與小晶粒之間堆疊得 非常緻密。此相外觀與 Ni₃Sn₄相相似,應為 Ni₃Sn₄相晶格 中因鎳原子被大量溶解之銅原子所取代,所以在組成上轉變 為 Cu₆Sn5 相,但結構上仍類似 Ni₃Sn₄相之過渡狀態。

3.2 Sn-3.0Ag-0.5Cu/Au/Pd/Ni/Cu 之界面反應

Fig. 2(a)為 Sn-3.0Ag-0.5Cu/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶,於反應 溫度 270°C,反應時間 1 小時的 BEI 影像。反應一開始,鍵 層 Au、Pd 皆溶進銲料裡,留下 Ni 鍍層與 SAC 銲料反應, 於界面上可以觀察到兩層不同顏色的相,靠近銲料顏色為淺 灰色,厚度較厚且不平整,此為(Cu,Ni) $_6$ Sn₅相。而靠近基材 顏色為深灰色,厚度薄且不連續,則為 Cu₃Sn 相。Fig. 2(b) 為 Sn-3.0Ag-0.5Cu/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶,於反應溫度 270°C, 反應時間 2 小時的 BEI 影像。(Cu,Ni) $_6$ Sn₅ 相與 Cu₃Sn 相兩者 厚度皆有隨著反應時間增加而增厚,而且(Cu,Ni) $_6$ Sn₅相亦有 逐漸往銲料中剝離的現象。Fig. 2(c)為 SAC/Au/Pd/Ni/Cu 反 應偶,於反應溫度 270°C,反應時間 4 小時的 BEI 影像。圖 中塊狀(Cu,Ni) $_6$ Sn₅相往銲料中剝離,經由 EPMA 定量分析, 其組成為(Cu $_0$ Ni $_0$ 20) $_6$ Sn₅; 而靠近基材與 Cu₃Sn 相的連續狀 (Cu,Ni) $_6$ Sn₅相,其組成則為(Cu $_0$.86Ni $_0$.14) $_6$ Sn₅,此結果相似於 Sn/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶,其反應機制亦相同。



Fig. 2 SAC/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶, 在反應溫度 270℃下, 於不 同反應時間(a) 1 小時(b) 2 小時(c) 4 小時之 BEI 影像。

Fig. 3(a)為 Sn-3.0Ag-0.5Cu/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶,於反應 溫度 270°C下,未酸蝕刻的 OM 影像。Fig. 3(b)則為酸蝕刻 5 分鐘後的 SEI 影像。此區域為 IMC 剝離界面的現象。Fig. 3(c) 為 Fig. 3(b)之局部放大圖,位於靠近銲料之(Cu,Ni)_6Sn5相, 經由 EDX 定量分析,其組成為(Cu_{0.77}Ni_{0.23})_6Sn5;成長形態 為多邊形角柱體之晶粒,晶粒間不規則排列且堆疊較為鬆 散,然而其表面有黏附著小顆球形之晶粒,此為 Ag₃Sn 相。 Fig. 3(d)為 Fig. 3(b)之局部放大圖,位於下方靠近 Cu 基材之 (Cu,Ni)_6Sn5相,組成則為(Cu_{0.96}Ni_{0.04})_6Sn5;因為(Cu,Ni)_6Sn5 相只溶入少量的 Ni,其成長形態較為圓滑,類似於 Cu₆Sn5 相為扇貝狀之晶粒。比較兩者(Cu,Ni)_6Sn5 相所溶入的 Ni 含 量不同,則會導致其界面生成物形態亦不同。



Fig. 3(a) SAC/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶,在反應溫度 270℃下,反 應時間 1 小時,未酸蝕刻之 OM 影像。(b)為酸蝕刻 5 分鐘之界面 SEI 影像。(c)、(d)為(b)之局部放大圖。

3.3 Sn-0.7Cu/Au/Pd/Ni/Cu 之界面反應

Fig. 4(a)為 Sn-0.7Cu/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶,於反應溫度 270℃,反應時間1小時的 BEI 影像。反應一開始,鍍層 Au、 Pd 亦會溶進銲料裡,留下 Ni 鍍層與 Sn-0.7Cu 銲料反應,於 界面上可以觀察到雨層不同顏色的相,靠近基材顏色為深灰 色,厚度薄且不連續,則為 Cu₃Sn 相。而靠近銲料顏色為淺 灰色,厚度較厚且不平整,此為(Cu,Ni)₆Sn₅ 相。Fig. 4(b)為 Sn-0.7Cu/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶,於反應溫度 270℃,反應時 間 2 小時的 BEI 影像。與 Sn/Au/Pd/Ni/Cu SAC/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶比較之下,(Cu,Ni)₆Sn₅ 相在銲料中剝離的現象較為嚴 重。此銲料中剝離現象的產生,應為銲料中含微量 Cu 所導 致,其反應機制為銲料中的 Cu 也會朝界面擴散並在靠近界 面附近,取代了原本 Ni 將與 Sn 的反應,而生成(Cu,Ni) $_{6}$ Sn₅ 相,因而產生類似剝離的現象。然而隨著反應時間增加, Cu_3Sn 相與(Cu,Ni) $_{6}$ Sn₅相兩者厚度皆有明顯增厚的現象。Fig. 4(c)為 Sn-0.7Cu/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶,於反應溫度 270°C,反 應時間 4 小時的 BEI 影像。圖中往銲料中剝離的(Cu,Ni) $_{6}$ Sn₅ 相區域,經由 EPMA 定量分析,其組成為(Cu_{0.82}Ni_{0.18}) $_{6}$ Sn₅; 靠近 Cu_3Sn 相的(Cu,Ni) $_{6}$ Sn₅相,組成則為(Cu_{0.85}Ni_{0.15}) $_{6}$ Sn₅, 此結果相似於 Sn/Au/Pd/Ni/Cu 、SAC/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶, 其反應機制亦相同。





Fig. 4 Sn-0.7Cu/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶, 在反應溫度 270℃下, 於不同反應時間(a) 1 小時(b) 2 小時(c) 4 小時之 BEI 影像。

Fig. 5(a)為 Sn-0.7Cu/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶,於反應溫度 270°C下,反應時間 1 小時,未酸蝕刻的 OM 影像。Fig. 5(b) 則為酸蝕刻 5 分鐘後的 SEI 影像。此區域為 IMC 剝離界面 的現象。Fig. 5(c)為 Fig. 5(b)之局部放大圖,其位於界面上方 且靠近銲料之(Cu,Ni) $_{6}$ Sn₅相,經由 EDX 定量分析,其組成 為(Cu_{0.72}Ni_{0.28}) $_{6}$ Sn₅;成長形態為多邊形角柱體且尾部呈尖端 狀之晶粒,與 SAC/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶所產生的(Cu,Ni) $_{6}$ Sn₅ 相比較,其差異於晶粒間不規則的堆疊卻較為緻密。Fig. 5(d) 為 Fig. 5(b)之局部放大圖,位於靠近基材之(Cu,Ni) $_{6}$ Sn₅相, 其組成則為(Cu_{0.95}Ni_{0.05}) $_{6}$ Sn₅;因為(Cu,Ni) $_{6}$ Sn₅相, 其組成則為(Cu_{0.95}Ni_{0.05}) $_{6}$ Sn₅;因為(Cu,Ni) $_{6}$ Sn₅相, 其組成則為(Cu_{0.95}Ni_{0.05}) $_{6}$ Sn₅;因為(Cu,Ni) $_{6}$ Sn₅相為扇貝狀 之晶粒。此結果與 SAC/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶相似,相較兩者 (Cu,Ni) $_{6}$ Sn₅相所溶入的 Ni 含量不同,則會導致其界面生成 物形態亦不同。

3.4 Sn-58Bi/Au/Pd/Ni/Cu 之界面反應

Fig. 6(a)為 Sn-58Bi/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶,於反應溫度 270°C,反應時間 1 小時的 BEI 影像。圖中 Sn-58Bi 銲料裡, 顏色較深為 Sn-rich,顏色較淺為 Bi-rich。反應一開始,鍍 層 Au、Pd 皆溶進銲料裡,留下 Ni 鍍層與 Sn-58Bi 銲料反應, 於界面上觀察到雨層不同顏色的相,靠近銲料顏色較淺,厚 度薄且不平整,經由 EPMA 定量分析,其組成為 Sn-38.27 at.% Ni -1.93 at.% Cu-2.24 at.% Pd,參照比對 Sn-Ni 二元相圖 [15],可得知其為 Ni₃Sn₄相。而靠近基材顏色較深且平整, 此為未完全消耗之 Ni 鍍層。當銲料內部 Bi 的濃度高時,會 抑制鍍層 Ni 往銲料內部擴散的速率,因此界面上的反應形 態為:Sn 緩慢擴散進入 Ni 鍍層,並且緩慢消耗 Ni,反應生 成 Ni₃Sn₄相,且由於反應較為緩慢,因此鍍層 Ni 底層結構 保有完整的擴散阻障,致使 Cu 被阻障無法參與界面反應因 而界面主要生成為 Ni₃Sn₄相。如 Fig. 6(b)、6(c),反應時間 各為 2、4 小時的 BEI 影像,隨著反應時間增加,Ni₃Sn₄相 厚度有明顯增加,相對於 Ni 鍍層則隨時間增加而減少。

Fig. 6(d)為 Sn-58Bi/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶,於反應溫度為 270°C,反應時間1小時,酸蝕刻5分鐘後的 SEI 影像。可 觀察到圖中 Ni₃Sn₄ 相的成長形態主要為緊密堆疊排列的細 針狀(needle-lke)之晶粒。



Fig. 5(a) Sn-0.7Cu/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶, 在反應溫度 270℃, 反應時間1小時, 未酸蝕刻之 OM 影像。(b)為酸蝕刻5 分鐘之界面 SEI 影像。(c)、(d)為(b)之局部放大圖。



Fig. 6 Sn-58Bi/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶, 在反應溫度 270℃下, 於不同反應時間(a) 1 小時(b) 2 小時(c) 4 小時之 BEI 影像, (d)為酸蝕刻 5 分鐘之界面 SEI 影像。

3.5 Sn-9Zn/Au/Pd/Ni/Cu 之界面反應

Fig. 7(a)為 Sn-9Zn/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶,於反應溫度為 270℃,反應時間1小時的 BEI 影像。圖中界面上可觀察到 三層不同顏色的相,靠近銲料顏色為淺灰色,厚度較薄且平 整,經由 EPMA 定量分析,其組成為 Zn-14.49 at.% Pd -2.68 at.% Cu-1.09 at.% Ni,比對 Pd-Zn 二元相圖[17]與 Pd-Zn-Sn 三元相圖[18-19],可得知其為 Pd2Zn9相。此原因為 Zn 活性 較高,容易與基材上的鍍層反應,反應一開始,鍍層 Au 很 薄而溶進銲料裡,留下 Pd 鍍層與 Zn 快速反應生成 Pd₂Zn₉ 相。而靠近基材顏色為深灰色,此為未完全消耗之 Ni 鍍層。 介於 Pd₂Zn₉相與 Ni 鍍層之間,顏色較為深黑色且平整,經 由 EPMA 定量分析,其組成為 Zn-46.09 at.% Ni-0.48 at.% Cu,比對Ni-Zn-Sn 三元相圖[20],可得知其為NiZn 相。Fig.7(b) 為 Sn-9Zn/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶,於反應溫度 270℃,反應時 間2小時的 BEI 影像。圖中 Pd₂Zn₉相厚度沒有明顯增厚, 表示 Pd 鍍層已完全與 Zn 反應,並沒有多餘的 Pd 提供使得 Pd2Zn9相厚度增加。隨著反應時間增加而鍍層 Ni 的消耗也

增加, 鍍層 Ni 足夠的提供, 使得 NiZn 相厚度有增厚的現象。 Fig. 7(c)為 Sn-9Zn/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶, 於反應溫度 270°C, 反應時間 4 小時的 BEI 影像。不同於反應時間 1、2 小時的 NiZn 相, 此層介金屬相出現兩種不同的顏色且混合的排列, 顏色為淺白色, 經由 EPMA 定量分析,其組成為 Zn-17.09 at.% Ni-2.07 at.% Cu,得知其為 Ni₅Zn₂₁相。顏色為深黑色, 則依然是 NiZn 相。其反應機制為:液態銲料中的 Zn 原子擴 散速率較 Ni 來的快,反應初期 Zn 原子會先通過 Pd 鍵層與 之反應生成 Pd₂Zn₉相,再往下擴散,由於 Pd₂Zn₉相生成的 同時會消耗 Zn 元素,使擴散進入與 Ni 鍵層反應的 Zn 擴散 通量較低,因而會生成 NiZn 相,隨著反應時間增加,Pd 鍵 層也被反應消耗完畢,此時 Zn 原子繼續擴散,且 Zn 擴散通 量增加,因而 NiZn 相會隨反應時間得增加而逐漸轉為形成 Ni₅Zn₂₁相。

Fig. 5(d)為 Sn-9Zn/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶,於反應溫度為 270℃,反應時間1小時,酸蝕刻5分鐘後的 SEI 影像。圖 中可觀察到 Pd₂Zn₉相的成長形態為大層面塊狀之晶粒,而 NiZn 相的成長形態則為平面狀之晶粒。



Fig. 7 Sn-9Zn/Au/Pd/Ni/Cu 反應偶, 在反應溫度 270℃下, 於不同反應時間(a) 1 小時(b) 2 小時(c) 4 小時之 BEI 影像, (d)為酸蝕刻 5 分鐘之 SEI 影像。

4、結論

Sn、Sn-3.0Ag-0.5Cu、Sn-0.7Cu 與 Au/Pd/Ni/Cu 液/固界 面反應中,Ni 鍍層皆完全消耗,界面上主要以(Cu,Ni)₆Sn₅ 與 Cu₃Sn 兩種介金屬相存在,然而隨著反應時間增加,兩種 IMC 厚度皆增厚,且(Cu,Ni)₆Sn₅相有逐漸往銲料中剝離之現 象。溶入 Ni 含量較多的(Cu,Ni)₆Sn₅相成長形態主要為多邊 形角柱體之晶粒,然而溶入 Ni 含量較少的(Cu,Ni)₆Sn₅相成 長形態則較為圓滑,類似於 Cu₆Sn₅相為扇貝狀的晶粒。 Sn-58Bi/Au/Pd/Ni/Cu 界面反應中,鍍層 Ni 未完全消耗,界 面生成物為細針狀晶粒的 Ni₃Sn₄相。Sn-9Zn/Au/Pd/Ni/Cu 界 面反應中,鍍層 Ni 亦未完全消耗,反應初期可發現大層面 塊狀晶粒的 Pd₂Zn₉相與平面狀晶粒的 NiZn 相生成,隨著反 應時間延長至4小時,除了 Pd₂Zn₉相外,還會有 NiZn 相與 Ni₅Zn₂₁相共存於界面上。 誌謝

本研究感謝優勝奈米科技有限公司在電鍍添加劑與電 鍍技術上的協助、台灣大學材料所操作人員高崇源先生協助 操作 EPMA;以及感謝台灣科技大學材料中心廖勝權先生, 協助操作 FE-SEM。 (NSC 93-2218-E-011-027)

參考文獻

- C. H. Wang, S. W Chen, Acta Materialia, vol. 54, pp. 247-253 (2006)
- 2. S. W. Chen and Y. W. Yen, Journal of Electronic Materials, v 28, pp. 1203-1208 (1999)
- 3. J. W. Yoon, S. B. Jung, Journal of Alloys and Compounds, vol. 396, pp. 122-127 (2005)
- 4. J. W. Yoon, S. B. Jung, Journal of Alloys and Compounds, vol. 359, pp. 202-208 (2003)
- 5. J. W. Yoon, S. W. Kim, S. B. Jung, Journal of Alloys and Compounds, vol. 385, pp. 192-198 (2004)
- 6. J. W. Yoon, S. W. Kim, S. B. Jung, Journal of Alloys and Compounds, vol. 392, pp. 247-252 (2005)
- C. Y. Lee, J. W. Yoon, Y. J. Kim, S. B. Jung, Microelectronic Engineering, vol. 82, pp. 561-568 (2005)
- 8. J. W. Yoon, S. W. Kim, S. B. Jung, Journal of Alloys and Compounds, vol. 415, pp. 56-61 (2006)
- W. H. Tao, C. Chen, C. E. Ho, W. T. Chen, C. R. Kao, Chemical Materials, vol. 13, pp. 1051-1056 (2001)
- W. T. Chen, C. E. Ho, C. R. Kao, Journal of Materials Research, vol. 17, pp. 263-266 (2002)
- 11. C. E. Ho, R. Y. Tsai, Y. L. Liu, C. R. Kao, Journal of Electronic Materials, vol. 31, pp. 584-590 (2002)
- C. E. Ho, Y. W. Lin, S. C. Yang, C. R. Kao, Journal of Electronic Materials, vol. 35, pp. 1017-1024 (2006)
- S. K. Kang, D. Y. Shih, K. Fogel, P. Lauro, M. J. Yim, G. Advocate, M. Griffin, C. Goldsmith, D. W. Henderson, T. Gosselin, D. King, J. Konrad, A. Sarkhel, K. J. Puttlitz, IEEE, vol. 25, pp. 155-160 (2002)
- N. Saunders and P. Miodwnik, ASM Handbook vol.3 Alloy Phase Diagrams, edited by H. Baker, ASM International, Materials Park, Ohio (1992)
- P. Nash and A. Nash, ASM Handbook vol.3 Alloy Phase Diagrams, edited by H. Baker, ASM International, Materials Park, Ohio (1992)
- B. F. Dyson, T. R. Anthony and D. Turnbull, Journal of Applied Physics, vol. 38, pp. 3408-3416 (1967)
- H. Okamoto, ASM Handbook vol.3 Alloy Phase Diagrams, edited by H. Baker, ASM International, Materials Park, Ohio (1990)
- Jiri Vizdal, Ales Kroupa, Jiri Popovic, Adela Zemanova, Advanced Engineering Materials, vol. 8, pp. 164-176 (2006)
- 19. C. Y. Chou, S. W. Chen, Acta Materialia, vol.54, pp. 2393-2400 (2006)
- M. Mita, M. Kajihara, N. Kurokawa, K. Sakamoto, Materials Science and Engineering A, vol. 403, pp. 269-275 (2005)